

《微观组织的分析电子显微学表征（英文版）》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2012年01月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：精装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787040300925

内容简介

本书系统地介绍了分析电子显微学（AEM）的基本概念和操作技术，聚集于相变和形变中位错的AEM研究。同时通过大量的例子阐述衍射晶体学的物理概念和数学分析方法，例如相变中位向关系的定量预测等，以便读者加深理解和拓展视野。

目录

Chapter 1 Analytical Electron Microscope (AEM)

1.1 Brief introduction of AEM history

1.2 Interaction between electrons and specimen and signals used by AEM

1.3 Electron wavelength and electromagnetic lens

1.3.1 Electron wavelength

1.3.2 Electromagnetic lens

1.4 Structure and function of AEM

1.4.1 Illumination system

1.4.2 Specimen holders

1.4.3 Imaging system

1.4.4 Image recording

1.4.5 Power supply system and vacuum system

1.4.6 Computer control

1.5 The principle of imaging, magnifying and diffracting

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)